

ZEISS scatterControl

独自の散乱線補正機構により 卓越したCT画像品質を実現



画像品質を最適化する ハードウェアソリューション

ZEISS scatterControl は、CTスキャンの画質を大幅に向上させ、散乱線アーチファクトを最小限に抑えます。これらの改善により、その後のデータ管理と適切な製品の評価ステップが可能になり、より正確な面定義と欠陥解析を実現します。

ZEISS scatterControl は、鉄が埋め込まれた金属積層造形製品やアルミニウム鋳造製品など、体積および密度の高い製品や、より密度の高い素材を含むアセンブリ品に有効です。



このモジュールは、既存機への追加オプションとして、または新しいシステムの購入時のオプションとして、**ZEISS METROTOM 1500 225kV G3** でご利用いただけます。ZEISS scatterControl でシステムをグレードアップすると、優れた画質が得られることにより、データ評価がはるかに簡単になります。

モジュールの位置決めが もたらす高い品質

ZEISS scatterControl はX線管とデテクタの間に取り付けられます。高密度の積層造形製品などの小さな製品はモジュールの前に設置し、大きな製品はモジュールの後ろに設置します。

物理的な衝突センサーと高度な衝突予測ソフトウェアが衝突を効果的に防止します。



アプリケーション

ZEISS scatterControl は、さまざまな製品、特に非常に体積が大きく密度の高い製品や、以下のようなさまざまな業界の製品に最適です：

鋳造

鉄が埋め込まれた厚みのあるアルミニウム
またはマグネシウム製品

自動車

鉄が埋め込まれた鋳造品、パワーエレクトロニクス

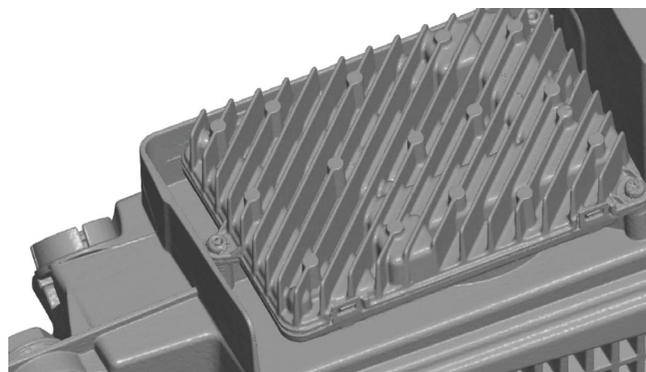
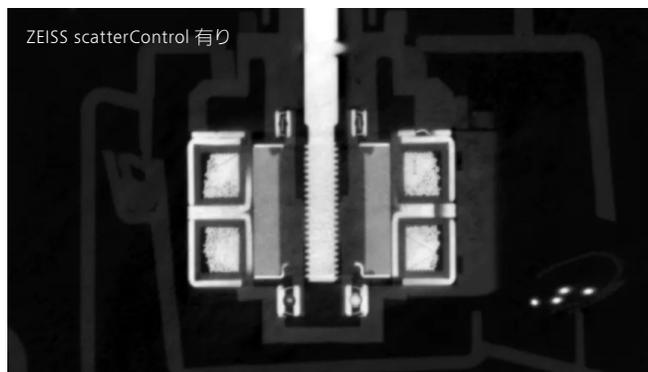
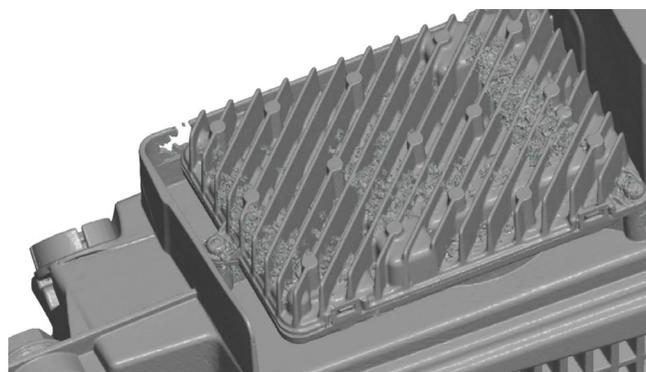
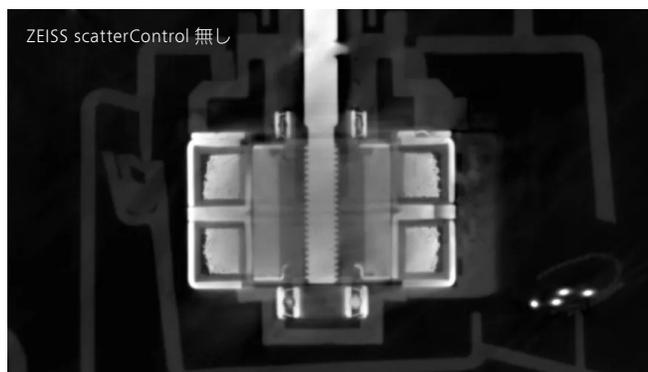
積層造形

高密度な金属プリント製品

3D検査を改善します

ボリュームデータが改善されることにより、評価がさらに容易になります。3Dサーフェスは、厄介なアーチファクトの影響を受けることなく定義され、レンダリングされます。多くのアーチファクトは通常、散乱線の影響によるものであり、正確な測定を妨げる3D疑似表面の原因となります。

ZEISS scatterControl による2D断面画像と3Dサーフェスの品質の向上をご覧ください。



ZEISS scatterControl のベネフィット



画像品質・欠陥検出能力の向上

散乱線によって引き起こされるアーチファクトの発生を低減することにより、CTの画質を大幅に向上させます。コントラストの向上により、欠陥の検出が大幅に簡素化されます。



面定義の品質の向上

面定義の品質を全体的に向上させます。これは、チャレンジングな製品を測定する際の大きなアドバンテージとなります。



VASTモードによる高速スキャン

「Stop & Go¹」モードと「VAST²」モードの両方で動作します。



簡単な操作

ワンクリックソリューションとして、VHD¹、AMMAR²、ボリューム結合³などの他の便利な機能とシームレスに連携し、ソフトウェアに完全に統合されています。

¹ METROTOM のスキャンモードの一種。ロータリテーブルが決められたピッチで動いて止まる動作を繰り返しながらスキャンを行う。

² METROTOM のスキャンモードの一種。Stop & Goモードと異なり、ロータリテーブルが止まらずに連続的に回転しながらスキャンを行う。

¹ METROTOM OS のオプション機能の一つ。横方向にテータの範囲を拡張することで撮像ボリュームを広げる。

² METROTOM OS のオプション機能の一つ。マルチマテリアルが起因となるアーチファクトを低減することができる。

³ METROTOM OS の標準機能。高さ方向に分割してスキャンしたデータを結合することで、高さ方向の撮像ボリュームを広げる。

カールツァイス株式会社
インダストリアルクオリティソリューションズ

〒102-0083
東京都千代田区麹町2-10-9
Tel: 0570-02-1310
Fax: 03-5214-1141
Email: info.metrology.jp@zeiss.com

〒564-0062
大阪府吹田市垂水町3-35-22
Tel: 06-6337-8031
Fax: 06-6337-7804
Internet: www.zeiss.co.jp/imt